

## FT 工程 歩留管理グラフ

管理機種 /PKG名 (Device name/ PKG name)
------------------------------------

工程名(Flow)

AUTO-

**BOX FTB No.**

班長 (GL)

[illegible]

4d	Time	1st.	2nd.	3rd.
履歴 ประวัติผล	3回前 ครั้งก่อนหน้า 3	前々回 ครั้งก่อนหน้า 2	前回 ครั้งก่อนหน้า	
月/日 M/D				
UCL				
AVE				
LCL				

Test Worst 5 ก่อนหน้า	
NG Test No.	
1	
2	
3	
4	
5	

Wafer No.																															
日付 DATE																															
初期歩留まり (Initial Yield)																															
カンバン (KANBAN)																															
特技依頼 (Request TE)																															
Worst 3	Test No.																														
	Worst 1																														
	Test No.																														
Test No.																															
Worst 3																															
การแก้ไข (アクション)																															
สาเหตุ (理由)																															
Tester No.																															
備考(ワケ)交換等		今 Now																													
จำนวนครั้งที่เปลี่ยน Socket สลับที่		1次 ครั้ง																													
		2次 ครั้ง																													
BIN16回数		M/C																													
จำนวนครั้งที่ BIN16		Tester																													
Pro.Ver																															
OP 者	1S																														
	2S																														
GL																															

<p><b>FT</b></p> <p>* ソケット点検結果記入要領</p> <p>① 検出不良品を Socket 計に計測する前に必ず</p> <p>* ロット毎の BIN1677-1 の回数を記入する</p> <p>※ 不良品を返す時に Bin 16</p>	<p><b>アクション (作業手順)</b></p> <p>欠品⇒保全依頼 計⇒計測依頼 再⇒再セッアップ</p> <p>M⇒PM request T⇒TE request RE⇒RE-SETUP</p> <p>ソケット交換 ⇒2 次調査</p> <p>SO⇒Change socket 2⇒2nd investigation</p>
<p>* 通常は、2 分で管理する</p> <p>FT process を行う際の管理時間 2 分</p> <p>※ 新機種へ、LCL を 99% で管理する</p> <p>※ 古い new device は旧機種で計測し LCL 99%</p> <p>※ 前データ欄には前データ の平均値 を 記入</p>	<p><b>原因 (สาเหตุ)</b></p> <p>BOX ⇒ テラスター 特⇒製品特性 セ⇒セッアップミス</p> <p>RE ⇒ BOX TE ⇒ TESTER D ⇒ DEVICE ON LINE SE ⇒ SETUP MISS</p> <p>キ⇒機台調整ノズキ ソ⇒ソケット交換</p> <p>M/C ⇒ M/C adjustment SO ⇒ Change socket</p>
<p>※ 最終点検後から前品を戻す場合は不良品として</p>	

UCL	AVE	LCL (2σ)
%	%	%

  

加工設備の点検 (σ値の表示)

**管理基準 (7σ管理) のการจัดการ (ค่าที่ประเมิน)**

- ① 実力値の 2σ を LCL とする (\* 以前の LCL からは下らない)  
 在庫水準を標準 2 σ のการจัดการจัดการการต่ำกว่า LCL ではない。  
 (เช่นในกรณีที่ค่าต่ำกว่า LCL อยู่นะ...)
- ② 力値の 4σ 以下は、排除して、LCL を決める時計算から除外する  
 เมื่อ LCL ถูกตัดทิ้งไป, ปล่อยกว่า 4 σ ของค่าความสามารถจะถูกยกเว้นจากการคำนวณ.
- ③ 歩留り 6 連続上昇・下降  
 เมื่อค่า Yield เป็นระดับเดียวกันต่อเนื่อง 6 จุด (เหมือนเส้น UCL หรือ ต่ำกว่า LCL)

**管理周期** ภารควบคุมระยะเวลากาไร

①確認周期...②回/LOT การตรวจสอบสภาพ yield ...② ครั้ง/ LOT  
(1次...②回期100cs 2次...②回終了時) ครั้งให้ 1...100 ชิ้นแรกของการผลิต LOT นั้น ครั้งทั้ง 2...②ตอนจบ LOT)

②管理基準変更周期...③LOT毎 ระยะเวลาเปลี่ยนแปลง Yield graph ...ทุก 30 LOT

③MAX3ヶ月 最新30日indexデータを見直し。 ภาวลดภายใน 3 เดือน ให้ทำการพิจารณาใหม่ทุกๆ 30 日  
(改善前より管理幅を拡大しない事) ห้ามไม่ให้ปรับระยะเวลากาไรยืดออกเกินที่กำหนด